

# SY3000 SOC测试系统

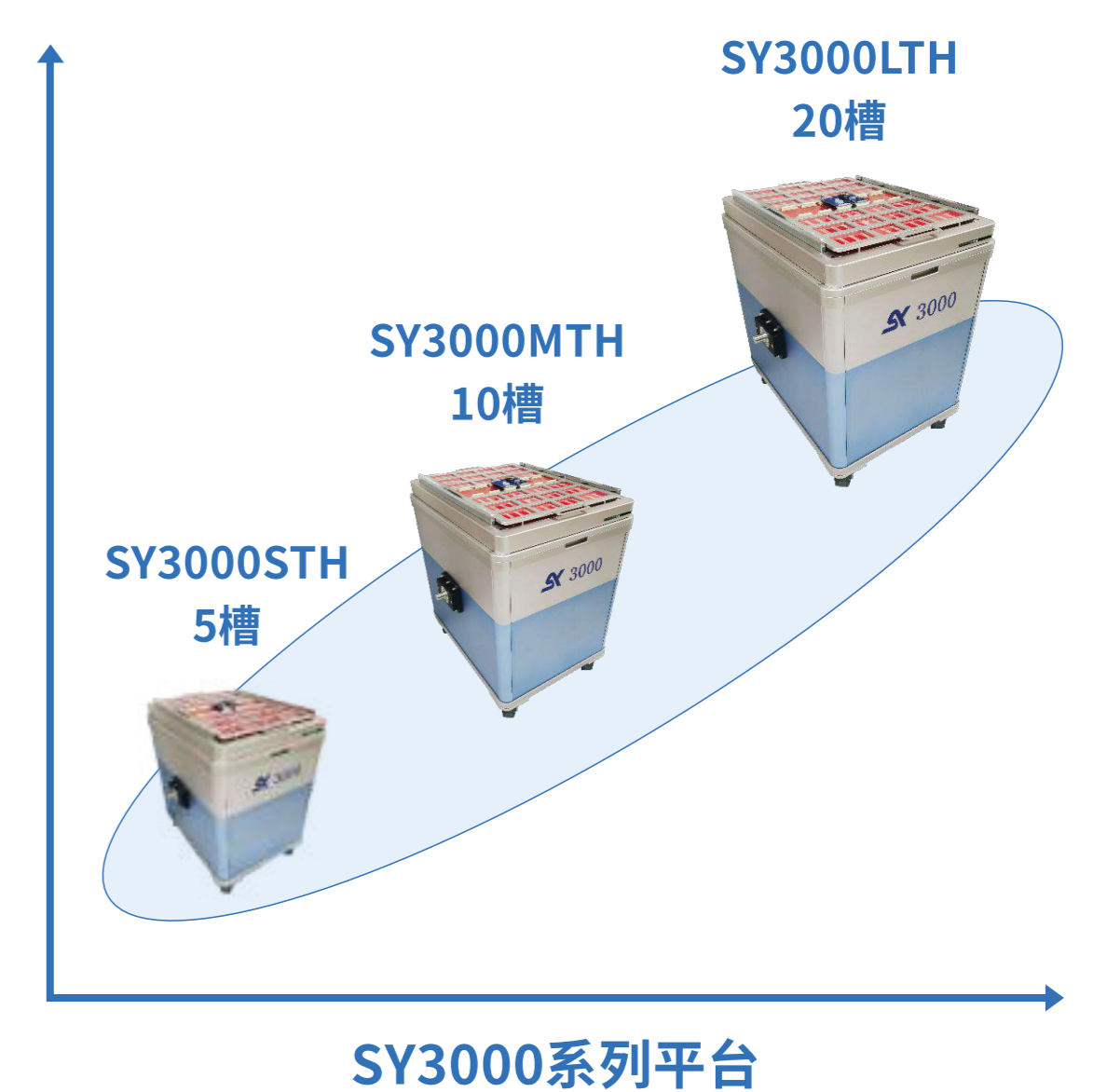
SY3000是一款高性能数模混合集成电路测试系统，测试资源可实现灵活配置，DIB (Load Board)板完全兼容V93000,节省用户资源。可提供超过2048个数字测试通道、16个模拟采集与任意波产生通道以及若干DPS电源测试通道，可完成通用逻辑芯片、存储器、处理器、可编程器件、高速串行、ADC、DAC、射频等集成电路的测试。



## 可扩展的SoC测试系统

系统能够实现多site并行测试、边界扫描测试，每个测试通道具有独立的PMU单元。通过配置不同种类和数量的测试模块，可以灵活满足用户的不同需求。

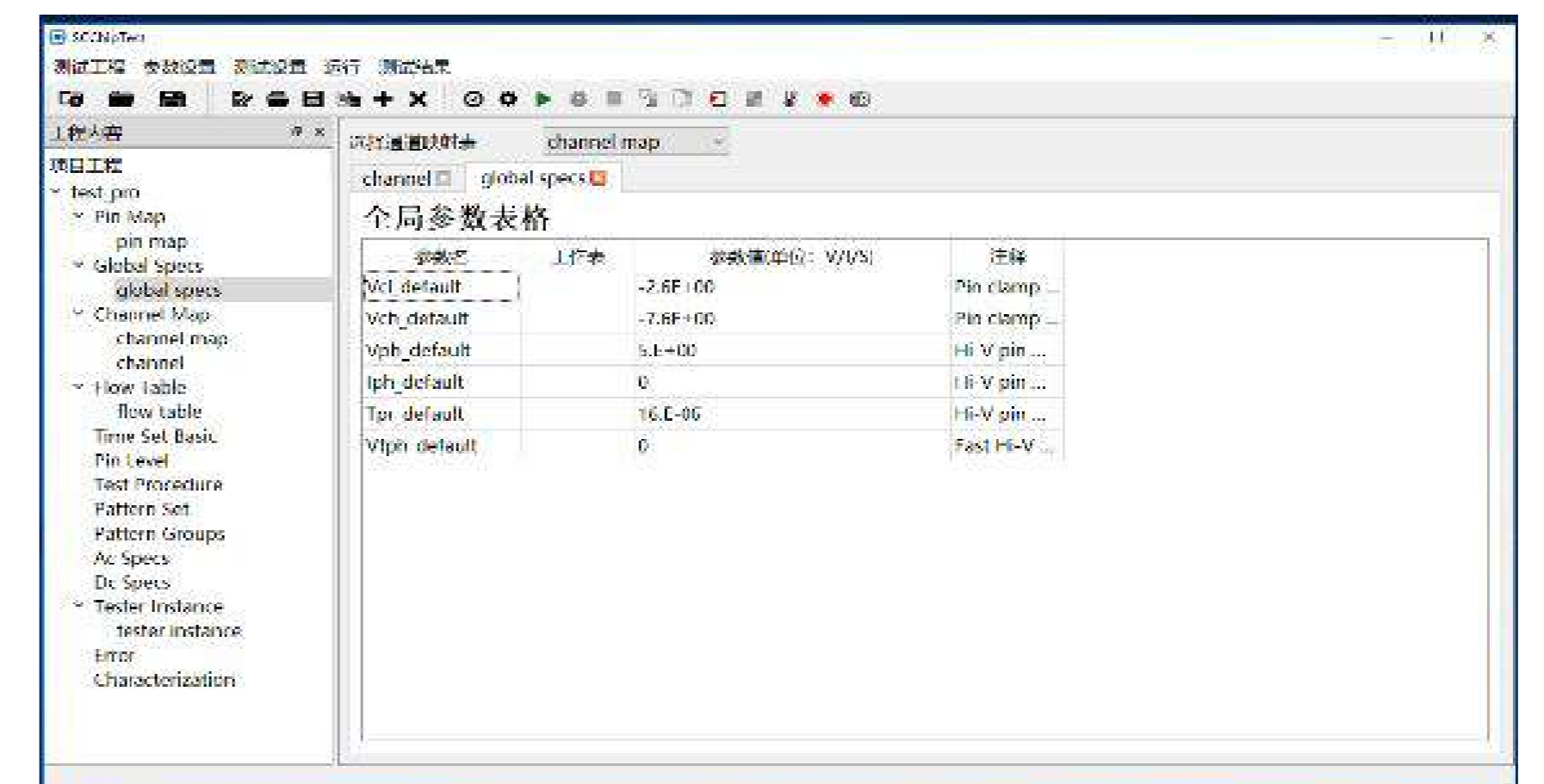
SY3000系列集成了多种高性能独立测试通道。在高同测数的情况下，每个测试通道可独立处理测试需求，从而获得最大的灵活性及最优的性能。测试处理器的整体控制确保在数字板、模拟板、电源板、射频板等所有类型的测试板间的时序同步。用户因此可以获得更短的测试时间、更优的可重复性和更简化的测试程序创建步骤。当测试需求发生变化时，SY3000系列的系统可通过搭载新的测试板轻松地扩展配置来满足新的需求。



## 系统平台

### 软件平台

SYtest为SY3000等速跃系列ATE产品的测试工程开发软件平台，开发人员可在该平台上完成测试工程的开发、调试，实现集成电路的测试和测试数据的获取。SYtest主要包含工程开发编辑和向量编辑调试两部分。可实现：**测试工程开发、测试参数验证、测试结果读取和保存。**



### 硬件平台

- DIB (Load Board)板完全兼容V93000,节省用户资源；
- 支持超大规模SOC测试；
- 支持多种测试速度的数字通道板卡混插；
- 支持高速数字、复杂混合信号、Memory、Flash等各类器件测试；
- 支持多板卡组测试；
- 支持以128通道为最小扩展单位，可扩展通道数不少于2048个；
- 支持FPGA、ADC、DAC测试；
- 支持最大256片的并行测试；
- 提供图形化和高级语言编程环境，支持用户开发新型芯片测试程序。

### 测试板

	DT2400	
<p>数字测试板</p>	通道数:256	最大数据速率:2.4Gbps
	边沿定位精度:±80ps	最大向量存储深度:256MV/通道
	驱动/输入电平范围:-1.5V~+6.5V	
<p>AT200模拟测试板</p>	4通道16位任意波:最大采样速率200MSPS,分辨率16bits,输出带宽(-3dB)50MHz	
	4通道24位任意波:最大采样速率192KSPS,分辨率24bits,输出带宽50KHz	
	4通道16位数字化仪:最大采样速率200MSPS,分辨率16bits,带宽(-3dB)50MHz	
	4通道24位数字化仪:最大采样速率1MSPS,分辨率24bits,带宽(-3dB)100KHz	
<p>DPS3210电源板</p>	通道数:32	输出电压范围:-10V~10V 输出电压精度:±0.1% 单通道最大输出电流:1.2A(可并联)

总公司:深圳速跃芯仪科技有限公司

http: www.szsytest.com

Email:info@szsytest.com

地址:广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-20号E栋402(龙华电科集成电路测试产业园)

成都子公司:速跃芯仪(成都)科技有限公司

地址:成都市高新西区蜀新大道600号联东U谷成都高新电子产业园6#2

